

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19)世界知的所有権機関
国際事務局



(43)国際公開日
2005年6月16日 (16.06.2005)

PCT

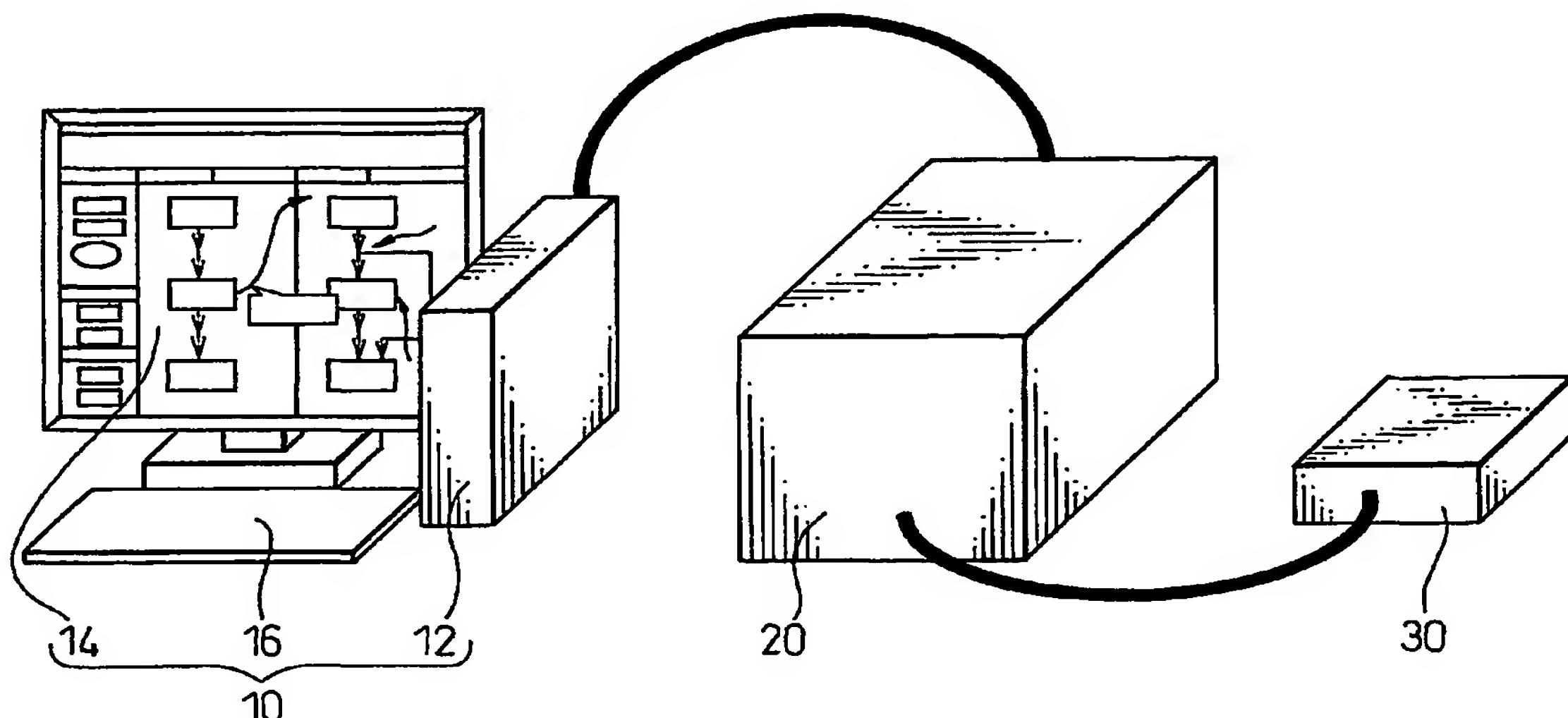
(10)国際公開番号
WO 2005/054883 A1

(51)国際特許分類: G01R 31/3183
(21)国際出願番号: PCT/JP2004/017970
(22)国際出願日: 2004年11月26日 (26.11.2004)
(25)国際出願の言語: 日本語
(26)国際公開の言語: 日本語
(30)優先権データ:
特願2003-402159 2003年12月1日 (01.12.2003) JP
(71)出願人(米国を除く全ての指定国について): 富士通テン株式会社 (FUJITSU TEN LIMITED) [JP/JP]; 〒6528510 兵庫県神戸市兵庫区御所通1丁目2番28号 Hyogo (JP).
(72)発明者; および
(75)発明者/出願人(米国についてのみ): 石尾 雅人 (ISHIO, Masato) [JP/JP]; 〒6528510 兵庫県神戸市兵庫区御所通1丁目2番28号 富士通テン株式会社内 Hyogo (JP).
久井 茂幸 (HISAI, Shigeyuki) [JP/JP]; 〒6528510 兵庫県神戸市兵庫区御所通1丁目2番28号 富士通テン株式会社内 Hyogo (JP). 網江 岳朋 (AMIE, Taketomo) [JP/JP]; 〒6528510 兵庫県神戸市兵庫区御所通1丁目2番28号 富士通テン株式会社内 Hyogo (JP). 内橋 浩二 (UCHIHASHI, Koji) [JP/JP]; 〒6528510 兵庫県神戸市兵庫区御所通1丁目2番28号 富士通テン株式会社内 Hyogo (JP).
(74)代理人: 青木 篤, 外(AOKI, Atsushi et al.); 〒1058423 東京都港区虎ノ門三丁目5番1号 虎ノ門37森ビル 青和特許法律事務所 Tokyo (JP).
(81)指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,

[続葉有]

(54) Title: CONTROL DEVICE INSPECTION DEVICE, PATTERN SIGNAL GENERATION DEVICE, AND INSPECTION PROGRAM CREATION DEVICE

(54)発明の名称: 制御装置の検査装置、パターン信号作成装置及び検査プログラム生成装置



(57) Abstract: There is provided a device for supporting creation of an inspection program executed by a simulator which automatically inspects an electronic device. The device reduces the number of preparation work steps in automatic inspection and improves reliability. The device is an inspection device including: a simulation unit for simulating a control object of a control device; and an inspection unit for inspecting the operation of the control device according to the relationship between a pattern signal inputted to the control device and an output signal outputted from the simulation unit in accordance with the pattern signal. The inspection unit inspects operation of the control device at a predetermined timing and performs retry judgment by a predetermined number of times when judgment that operation of the control device is normal cannot be obtained.

[続葉有]

WO 2005/054883 A1



SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,
VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE,
SN, TD, TG).

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,
SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY,
KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,
CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,
IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI

添付公開書類:
— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイドスノート」を参照。

(57) 要約: 電子機器を自動検査するシミュレータで実行される検査プログラムの作成を支援する装置であって、自動検査における準備作業工数の低減及び信頼性の向上を図る装置。この装置は、制御装置の制御対象を模擬するシミュレートユニットと、その制御装置に入力するパターン信号と該パターン信号に応じてシミュレートユニットから出力される出力信号との関係に基づいて、制御装置の動作を検査する検査ユニットと、を備えた検査装置であって、検査ユニットは、所定のタイミングで制御装置の動作を検査するものであり、制御装置の動作が正常であるとの判定が得られない場合には、所定回数のリトライ判定を行う。